背的北文献

PC-9169

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報(A)

計6件 (11)特許出願公開番号

特開2002-371114/

(P2002-371114A)

(43) 公開日 平成14年12月26日(2002.12.26)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FΙ		テー	マコード (参考)	
CO8F 20/28		CO8F 20/28		2H025		
CO7D307/33		CO7D3O7/77		4C037		
307/77		307/94		4J100		
307/94		G03F 7/039	601			
G03F 7/039	601	CO7D3O7/32		G		
		審査請求 未請求 請求項の数	8 OL	(全18頁)	最終頁に続く	

(21)出願番号

特願2001-179614(P2001-179614)

(22)出願日

平成13年6月14日(2001.6.14)

(71)出願人 000002060

信越化学工業株式会社

東京都千代田区大手町二丁目6番1号

(72)発明者 金生 剛

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工業株式会社新機能材料技術研究

(74)代理人 100079304

弁理士 小島 隆司 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】ラクトン構造を有する新規(メタ)アクリレート化合物、重合体、フォトレジスト材料、及びパタ ーン形成法

(57)【要約】

【解决手段】 一般式(1)で表される(メタ)アクリ レート化合物。

【化1】



(式中、R'はH又はCH,、R'、R'はH又はアルキル 基、Xは、ノルボルナン環、ビシクロ[2.2.2]オ クタン環、7-オキサノルボルナン環、又はシクロヘキ サン環構造を形成する基、点線は該構造とγープチロラ クトン環構造とを結合する。)

【効果】 本発明の重合体は透明性、特にエキシマレー ザー露光波長での透明性に優れている。

T AVAILABLE

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)で表される(メタ)アクリレート化合物。

I

【化1】

(式中、 R^1 は水素原子又はメチル基、 R^2 、 R^3 は水素原子、又は炭素数 $1\sim15$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基を表し、 R^1 と R^3 は結合して環を形成してもよく、その場合には、 R^1 と R^3 で炭素数 $2\sim15$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を表す。 X はって H_1 、一、 H_2 、一もしくは一〇一又は互いに分離した H_3 2個の H_4 であることを表す。 点線はノルボルナン環、ビシクロ H_4 この、 H_4 に対したのでは、 H_4 で炭素数 H_4 の構造と H_4 で炭素原子を共有する構造を表す。)

【請求項2】 下記一般式(2)で表される(メタ)アクリレート化合物。

【化2】

$$= \int_{0}^{R^{1}} \left(\frac{1}{x} \right)^{R^{2}}$$

(式中、 R^1 は水素原子又はメチル基、 R^1 、 R^3 は水素原子、又は炭素数 $1\sim 15$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基を表し、 R^1 と R^3 で炭素数 $2\sim 15$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を表す。 X はって H_1 ー、 H_2 ー H_3 一 H_4 一 H_4 一 H_5 一 H_5 一 H_5 一 H_6 一 H_7 一 H_8 — H_8 —

【請求項3】 下記一般式(3)又は(4)で表される(メタ)アクリレート化合物。 【化3】

$$= \begin{pmatrix} R' \\ X \\ X \\ R' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R' \\ X \\ R' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R' \\ X \\ R' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R' \\ X \\ R' \end{pmatrix}$$

(式中、R'は水素原子又はメチル基、R'、R'は水素原子、又は炭素数1~15の直鎖状、分岐状もしくは環10 状のアルキル基を表し、R'とR'は結合して環を形成してもよく、その場合には、R'とR'で炭素数2~15の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を表す。Xは-CH₁-、-CH₁-もしくは-O-又は互いに分離した2個の-Hであることを表す。)

【請求項4】 下記一般式(5)で表される(メタ)アクリレート化合物。

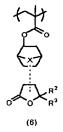
【化4】

(5

(式中、R'は水素原子又はメチル基、R'、R'は水素原子、又は炭素数1~15の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基を表し、R'とR'は結合して環を形成してもよく、その場合には、R'とR'で炭素数2~15の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を表す。Xは~30 CH₁ - 、- CH₁ CH₂ - もしくは-O-又は互いに分離した2個の-Hであることを表す。)

【請求項5】 下記一般式(6)で表される繰り返し単位を含有することを特徴とする重合体。

【化5】



(式中、R'は水素原子又はメチル基、R'、R'は水素原子、又は炭素数1~15の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基を表し、R'とR'は結合して環を形成してもよく、その場合には、R'とR'で炭素数2~15の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を表す。XはーCH, -、-CH, CH, -もしくは-O-又は互いに分離した2個の-Hであることを表す。点線はノルボルナン環、ピシクロ[2.2.2]オクタン環、7-オキサ

ノルボルナン環、又はシクロヘキサン環構造とアープチ ロラクトン環構造とを結合する単結合、二価の有機基又 はこれら両環構造間で一個又は二個の構成炭素原子を共 有する構造を表す。)

【請求項6】 更に、下記一般式(7)で表される繰り 返し単位を含有し、重量平均分子量が2,000~10 0.000である請求項5記載の重合体。

【化6】

(式中、R'は水素原子又はメチル基、R'は炭素数4~ 20の三級アルキル基を表す。)

【請求項7】 (A) 請求項5又は6記載の重合体、

(B)酸発生剤、(C)有機溶剤を含有することを特徴 とするフォトレジスト材料。

【請求項8】 (1) 請求項7記載のフォトレジスト材 料を基板上に塗布する工程と、(2)次いで加熱処理 後、フォトマスクを介して波長300nm以下の高エネ ルギー線もしくは電子線で露光する工程と、(3)必要 に応じて加熱処理した後、現像液を用いて現像する工程 とを含むことを特徴とするパターン形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、微細加工技術に適 した化学増幅型レジスト材料のベース樹脂用のモノマー として有用なラクトン構造を有する新規(メタ)アクリ レート化合物、これを原料とした重合体、該重合体を含 30 むフォトレジスト材料、及びパターン形成法に関する。 [0002]

【従来の技術】近年、LSIの高集積化と高速度化に伴 い、パターンルールの微細化が求められているなか、次 世代の微細加工技術として遠紫外線リソグラフィーが有 望視されている。中でもKrFエキシマレーザー光、A rFエキシマレーザー光を光源としたフォトリソグラフ ィーは、0.3μm以下の超微細加工に不可欠な技術と してその実現が切望されている。

【0003】エキシマレーザー光、特に波長193nm 40 のArFエキシマレーザー光を光源としたフォトリソグ ラフィーで用いられるレジスト材料に対しては、該波長 における高い透明性を確保することは当然として、薄膜 化に対応できる高いエッチング耐性、高価な光学系材料 に負担をかけない高い感度、そして何よりも、微細なパ ターンを正確に形成できる高い解像性能を併せ持つこと が求められている。それらの要求を満たすためには、高 透明性、髙剛直性かつ高反応性のベース樹脂の開発が必 至であるが、現在知られている高分子化合物の中にはそ れらの特性をすべて備えるものがなく、未だ実用に足る 50

レジスト材料が得られていないのが現状である。

【0004】高透明性樹脂としては、アクリル酸又はメ タクリル酸誘導体の共重合体、ノルボルネン誘導体由来 の脂肪族環状化合物を主鎖に含有する髙分子化合物等が 知られているが、そのいずれもが満足のいくものではな い。例えば、アクリル酸又はメタクリル酸誘導体の共重 合体は、高反応性モノマーの導入や酸不安定単位の増量 が自由にできるので反応性を高めることは比較的容易だ が、主鎖の構造上剛直性を高めることは極めて難しい。 10 一方、脂肪族環状化合物を主鎖に含有する高分子化合物 については、剛直性は許容範囲内にあるものの、主鎖の 構造上ポリ(メタ)アクリレートよりも酸に対する反応 性が鈍く、また重合の自由度も低いことから、容易には 反応性を高められない。加えて、主鎖の疎水性が高いた めに、基板に塗布した際に密着性が劣るという欠点も有 する。従って、これらの高分子化合物をベース樹脂とし てレジスト材料を調製した場合、感度と解像性は足りて いてもエッチングには耐えられない、あるいは許容でき るエッチング耐性を有していても低感度、低解像性で実 20 用的でないという結果に陥ってしまう。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記事情に鑑 みなされたもので、300nm以下の波長、特にArF エキシマレーザー光を光源としたフォトリソグラフィー において、密着性と透明性に優れたフォトレジスト材料 製造用のモノマーとして有用なラクトン構造を有する (メタ) アクリレート化合物、これを原料とした重合 体、フォトレジスト材料、及びパターン形成方法を提供

[0006]

することを目的とする。

【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】本 発明者らは、上記目的を達成するため鋭意検討を重ねた 結果、後述する方法により下記一般式(1)、(2)、 (3)、(4)、(5)で表されるラクトン構造を有す る(メタ)アクリレート化合物が高収率かつ簡便に得ら れること、更に、この(メタ)アクリレート化合物を用 いて得られた樹脂が、エキシマレーザーの露光波長での 透明性が高く、これをペース樹脂として用いたレジスト 材料が、基板密着性に優れることを知見した。

【0007】即ち、本発明は、以下の(メタ)アクリレ ート化合物、重合体、フォトレジスト材料、及びパター ン形成法を提供する。

【0008】(I)下記一般式(1)で表される(メ タ) アクリレート化合物。

【化7】

(式中、R'は水素原子又はメチル基、R'、R'は水素 原子、又は炭素数1~15の直鎖状、分岐状もしくは環 状のアルキル基を表し、R'とR'は結合して環を形成し 10 てもよく、その場合には、R'とR'で炭素数2~15の 直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を表す。Xは一 CH, -、-CH, CH, -もしくは-O-又は互いに分 離した2個の-Hであることを表す。点線はノルボルナ ン環、ビシクロ[2.2.2]オクタン環、7-オキサ ノルボルナン環、又はシクロヘキサン環構造とアープチ ロラクトン環構造とを結合する単結合、二価の有機基又 はこれら両環構造間で一個又は二個の構成炭素原子を共 有する構造を表す。)

ート化合物。

【化8】

(式中、R'は水素原子又はメチル基、R'、R'は水素 原子、又は炭素数1~15の直鎖状、分岐状もしくは環 状のアルキル基を表し、R'とR'は結合して環を形成し てもよく、その場合には、R'とR'で炭素数2~15の 直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を表す。Xは一 CH, -、-CH, CH, -もしくは-O-又は互いに分 離した2個の-Hであることを表す。Yは一個又は複数 個のメチレン基が酸素原子に置換されていてもよい一 (CH₁)。- を表す。 n は 0 ≤ n ≤ 6 を満たす整数を表

(I I I) 下記一般式(3) 又は(4) で表される(メ 40 タ) アクリレート化合物。

【化9】

す。)

(式中、R'は水素原子又はメチル基、R'、R'は水素 50

原子、又は炭素数1~15の直鎖状、分岐状もしくは環 状のアルキル基を表し、R'とR'は結合して環を形成し てもよく、その場合には、R'とR'で炭素数2~15の 直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を表す。Xは一 $CH_1 - CH_2 CH_3 - もしくは - O - 又は互いに分$ 離した2個の-Hであることを表す。)

(IV) 下記一般式(5) で表される(メタ) アクリレ ート化合物。

【化10】

$$= \bigvee_{0}^{R'} \bigcap_{R^{1}}$$

(式中、R'は水素原子又はメチル基、R'、R'は水素 原子、又は炭素数1~15の直鎖状、分岐状もしくは環 状のアルキル基を表し、R¹とR¹は結合して環を形成し (II) 下記一般式(2) で表される(メタ) アクリレ 20 てもよく、その場合には、R²とR³で炭素数2~15の 直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を表す。Xは一 CH, -、-CH, CH, -もしくは-O-又は互いに分 離した2個の-Hであることを表す。)

> (V) 下記一般式(6) で表される繰り返し単位を含有 することを特徴とする重合体。

【化11】

(式中、R'は水素原子又はメチル基、R'、R'は水素 原子、又は炭素数1~15の直鎖状、分岐状もしくは環 状のアルキル基を表し、R'とR'は結合して環を形成し てもよく、その場合には、R²とR³で炭素数2~15の 直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を表す。Xは-CH, -、-CH, CH, -もしくは-O-又は互いに分 離した2個の-Hであることを表す。点線はノルボルナ ン環、ビシクロ[2.2.2]オクタン環、7-オキサ ノルボルナン環、又はシクロヘキサン環構造とγープチ ロラクトン環構造とを結合する単結合、二価の有機基又 はこれら両環構造間で一個又は二個の構成炭素原子を共 有する構造を表す。)

(VI) 更に、下記一般式(7)で表される繰り返し単 位を含有し、重量平均分子量が2,000~100,0 00である(V)記載の重合体。

【化12】

(式中、R¹ は水素原子又はメチル基、R¹ は炭素数 4 ~ 2 0 の三級アルキル基を表す。)

(VII) (A) (V) 又は (VI) 記載の重合体、

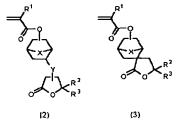
(B) 酸発生剤、(C) 有機溶剤を含有することを特徴とするフォトレジスト材料。

(VIII) (1) (VII) 記載のフォトレジスト材料を基板上に塗布する工程と、(2) 次いで加熱処理後、フォトマスクを介して波長300nm以下の高エネルギー線もしくは電子線で露光する工程と、(3) 必要に応じて加熱処理した後、現像液を用いて現像する工程とを含むことを特徴とするパターン形成方法。

【0009】以下、本発明につき更に詳しく説明する。本発明の(メタ)アクリレート化合物は、下記一般式(1)で表されるものである。

【化13】

(式中、 R^1 は水素原子又はメチル基、 R^1 、 R^3 は水素原子、又は炭素数 $1\sim15$ 、好ましくは $1\sim8$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基を表し、 R^1 と R^3



(式中、Yは一個又は複数個のメチレン基が酸素原子に置換されていてもよいー(CH_1)。-を表す。 nは $0 \le n \le 6$ を満たす整数を表す。 R^1 、 R^1 、 R^3 、 X は上記 40 の通りである。)

は結合して環を形成してもよく、その場合には、R'とR'で炭素数2~15、好ましくは2~5の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を表す。Xは-CH₁-、-CH₁CH₁ーもしくは-O-又は互いに分離した2個の-Hであることを表す。点線はノルボルナン環、ビシクロ[2.2.2]オクタン環、7-オキサノルボルナン環、又はシクロヘキサン環構造とアーブチロラクトン環構造とを結合する単結合、二価の有機基又はこれら両環構造間で一個又は二個の構成炭素原子を共有する構造10を表す。)

【0010】ここで、Xが-CH,-である場合はノルボルナン環構造を形成し、Xが-CH,CH,-の場合はビシクロ[2.2.2]オクタン環構造を形成し、Xが-O-の場合は7-オキサノルボルナン環構造を形成する。また、Xが互いに分離した2個の-Hである場合は、下記に示すようにシクロヘキサン環構造を形成する。

[0011] [化14]

20

30

(州) 即ち (

【0012】また、上記点線において、二価の有機基としては、炭素数 $1\sim6$ のアルキレン基、炭素数 $2\sim5$ のオキサアルキレン基を挙げることができる。

【0013】上記(メタ)アクリレート化合物としては、下記式(2)で示されるものが好ましく、更には、下記式(3)、(4)、(5)で示されるものが好ましい

[0014]

【化15】

$$= \begin{pmatrix} R^1 \\ X \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R^2 \\ R^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ R^3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}$$

【0 0 1 5】本発明の(メタ)アクリレート化合物としては、具体的には下記のものを例示できる。

[0016]

【化16】

[0017]

40 【化17】

【0018】本発明の(メタ)アクリレート化合物は、例えば、下記の方法にて製造できるが、これに限定されるものではない。

【0019】一般式(1)で表される本発明の(メタ)アクリレート化合物は、対応するヒドロキシラクトン化合物(8)をエステル化(アクリロイル化又はメタクリロイル化)することによって得られる。

[0020]

【化18】

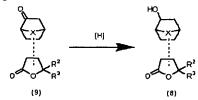
【0021】反応は公知の方法にて容易に進行するが、 好ましくは塩化メチレン等の溶媒中、原料のヒドロキシ ラクトン化合物(8)、(メタ)アクリル酸クロリド等 50 のエステル化剤、トリエチルアミン等の塩基を順次又は

同時に加え、必要に応じて冷却する等して行うのがよい。

【0022】ヒドロキシラクトン化合物(8)は、対応するケトラクトン化合物(9)を還元することによって得られる。

[0023]

(化19)



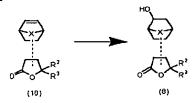
(式中、[H] は還元剤を表す。)

【0024】このケト基の還元には種々の還元剤を用いることができるが、還元剤として、具体的には、ボラン、アルキルボラン、ジアルキルジラン、トリアルキルシラン、水素化ナトリウム、水素化リチウム、水素化カルシウム等の金属水素化物類、水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素カルシウム、水素化ホウ素カリウム、水素化ホウ素カルシウム、水素化アルミニウムナトリウム、水素化アルミニウムリチウム、水素化ドリメトキシアルミニウムリチウム、水素化ドリオトキシアルミニウムリチウム、水素化ドリエチルボウ素リアルミニウムリチウム、水素化ドリエチルボウ素リテカムリチウム、水素化ドリエチルボウ素リチウムリチウム、水素化ドリエチルボウ素リチウム等の錯水素化塩類(Complex hydride)やそれらのアルコキシあるいはアルキル誘導体を例示できる。

【0025】また、ヒドロキシラクトン化合物(8)は、対応するオレフィンラクトン化合物(10)から合成することもできる。

[0026]

【化20】



【0027】原料のオレフィンラクトン化合物(10)としては、公知の化合物の他、既に出願した脂環構造を有する下記ラクトン化合物(特願2000-205217)や脂環構造を有するエポキシ化合物等を用いることができる。

[0028]

【化21】



(m=1~8) [0029] [化22]



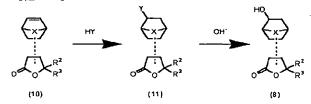
(式中、U、Zのうち一方は $-CR^0$ 3 R^0 4-Zは-C(=O) -を示し、他方は CH_1 を示す。 R^0 3、 R^0 4は それぞれ独立に水素原子、又は炭素数 $1\sim 6$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、また、 R^0 3、 R^0 4は互いに結合してこれらが結合する炭素原子と共に脂肪 族炭化水素環を形成してもよい。)

ラン、トリアルキルシラン、水素化ナトリウム、水素化 【0030】オレフィンラクトン化合物 (10) からヒリチウム、水素化カリウム、水素化カルシウム等の金属 ドロキシラクトン化合物 (8) への変換方法の一つは、水素化物類、水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素リ 20 オレフィンラクトン化合物 (10) への酸HYの付加のチウム、水素化ホウ素カルシウ 後、付加体のアルカリ加水分解又はアルカリ加溶媒分解ム、水素化アルミニウムナトリウム、水素化アルミニウ による方法である。

[0031]

【化23】

30



(式中、HYは酸、OH は塩基を表す。)

【0032】酸HYとして、具体的には、塩化水素酸、 塩酸、臭化水素酸、ヨウ化水素酸、硫酸等の無機酸類、 ギ酸、酢酸、プロピオン酸、安息香酸、クロロギ酸、ク ロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、フルオロ酢 酸、トリフルオロ酢酸、3,3,3-トリフルオロプロ ピオン酸等の有機酸類を例示できる。なお、オレフィン ラクトン化合物(9)へ付加させるHYとしてアクリル 酸又はメタクリル酸を使えれば、直接(メタ)アクリレ 40 一ト化合物(1)を合成することもできる。塩基〇H として、具体的には、水酸化ナトリウム、水酸化リチウ ム、水酸化カリウム、水酸化バリウム等の無機水酸化 物、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸リチウ ム、炭酸カリウム等の無機炭酸塩類、ナトリウムメトキ シド、ナトリウムエトキシド、リチウムメトキシド、リ チウムエトキシド、リチウム t e r t - プトキシド、カ リウムtertープトキシド等のアルコキシド類、ジエ チルアミン、トリエチルアミン、トリーn-ブチルアミ ン、ジメチルアニリン等の有機塩基類を例示できる。

0 【0033】また、 オレフィンラクトン化合物(1

15

0) からヒドロキシラクトン化合物(8) への変換の第 2の例として、オレフィンラクトン化合物(10)のエ ポキシ化の後、エポキシド化合物 (11) を還元的開裂 させる方法をあげることができる。

[0034]

【化24】

(式中、[O] は酸化剤、[H] は環元剤を表す。) 【0035】酸化剤[O]としては、具体的には、過ギ 酸、過酢酸、トリフルオロ過酢酸、m-クロロ過安息香 酸等の過酸類、過酸化水素、ジメチルジオキシラン、t ertープチルヒドロパーオキシド等の過酸化物類等を 例示できる。なお、これらの酸化剤を用いた反応の際、 金属又は金属塩類を触媒として共存させてもよい。還元 剤[H]としては、具体的には、水素、ボラン、アルキ 20 でき、良好な基板密着性を発揮するものと考えられる。 ルボラン、ジアルキルボラン、ジアルキルシラン、トリ アルキルシラン、水素化ナトリウム、水素化リチウム、 水素化カリウム、水素化カルシウム等の金属水素化物 類、水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素リチウム、 水素化ホウ素カリウム、水素化ホウ素カルシウム、水素 化アルミニウムナトリウム、水素化アルミニウムリチウ ム、水素化トリメトキシホウ素ナトリウム、水素化トリ メトキシアルミニウムリチウム、水素化ジエトキシアル ミニウムリチウム、水素化トリ t - プトキシアルミニウ ムリチウム、水素化ピス (2-メトキシエトキシ) アル 30 ミニウムナトリウム、水素化トリエチルホウ素リチウム 等の錯水素化塩類(Complex hydride) やそれらのアルコキシあるいはアルキル誘導体を例示で きる。なお、これらの還元剤を用いた反応の際、金属又 は金属塩類を触媒として共存させてもよい。

【0036】オレフィンラクトン化合物(10)からヒ ドロキシラクトン化合物(8)への変換の第3の方法と して水ホウ素化-酸化反応(Hydroboratio n-Oxidation) を例示できる。

[0037]

【化25】

【0038】オレフィンラクトン化合物(10)にボラ ン(BH、)を付加させた後、アルカリ条件下過酸化水 素水で酸化してヒドロキシラクトン化合物(8)に変換 50

するのが一般的であるが、公知の様々な水ホウ素化-酸 化反応の条件を適用できる。

【0039】本発明の重合体は、上記(メタ)アクリレ ート化合物をモノマーとして用いて得られ、この (メ タ) アクリレート化合物に由来する下記繰り返し単位 (6)を有するものである。

【化26】

【0040】上記の(メタ)アクリレート化合物をモノ

マーとして用いて合成したレジストポリマーにおいて、 極性基と考えられるプチロラクトン部分をアルキレン基 等のリンカーの有無や長さを適当に選択することによっ て、ポリマー主鎖から望ましい部位に位置させることが また、リンカーの長さや種類の適当なものを選択しモノ マーとして用いることで、ポリマー全体の脂溶性を調節 することができ、ポリマーの溶解特性をも制御できる。 【0041】本発明の重合体は、上記(メタ)アクリレ ート化合物と共に、これと共重合し得る他のモノマーを 用いて得ることが好ましく、本発明の(メタ)アクリレ ート化合物と共重合させる重合性化合物としては、重合 性炭素-炭素二重結合を有する各種の化合物が使用可能 である。具体的には、(メタ) アクリル酸などの α , β -不飽和カルボン酸類、(メタ)アクリル酸エステル、 クロトン酸エステル、マレイン酸エステルなどの α , β 不飽和カルボン酸エステル類、アクリロニトリルなど σ_{α} , β -不飽和ニトリル類、5, 6-ジヒドロ-2H -ピラン-2-オンなどの α , β -不飽和ラクトン類、 無水マレイン酸、無水イタコン酸、マレイミド類、ノル ボルネン誘導体、テトラシクロ[4.4.0.11.5.

【0042】この場合、特には式(7a)で示されるモ 40 ノマーを用いることにより、下記式 (7) で示される繰 り返し単位を導入することができる。

17.10] ドデセン誘導体、アリルエーテル類、ビニルエ

ーテル類、ビニルエステル類を例示できる。

[0043]

【化27】

$$\begin{array}{c}
CH_2 = CHR^4 \\
R^5O - C=0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^4 \\
O \\
D \\
D \\
\end{array}$$
(7a)

(式中、R'は水素原子又はメチル基、R'は炭素数4~

20の三級アルキル基を表す。)

【0044】ここで、上記一般式(7)において、R' は水素原子又はメチル基である。 R⁶ は炭素数 4~20 の三級アルキル基である。

【0045】R⁶の炭素数4~20の三級アルキル基と して具体的には、 t - プチル基、 t - ペンチル基、 1 -エチル-1-メチルプロピル基、トリエチルカルビニル 基、1-メチルシクロペンチル基、1-エチルシクロペ ンチル基、1-シクロペンチルシクロペンチル基、1-シクロヘキシルシクロペンチル基、1-メチルシクロへ 10 キシル基、1-エチルシクロヘキシル基、1-シクロペ ンチルシクロヘキシル基、1-シクロヘキシルシクロヘ キシル基、2-メチル-2-ノルボニル基、2-エチル -2-ノルボニル基、8-メチル-8-トリシクロ [5.2.1.01.6] デシル基、8-エチル-8-ト リシクロ[5.2.1.01.6] デシル基、2-メチル -2-アダマンチル基、2-エチル-2-アダマンチル 基、1-アダマンチル-1-メチルエチル基を例示でき るがこれらに限定されない。

【0046】本発明の(メタ)アクリレート化合物と他 20 の重合性化合物との重合はラジカル重合、アニオン重 合、カチオン重合などの常法により行うことができる。 【0047】なお、本発明の重合体において、式(6) の割合は1~90モル%、特に5~80モル%であるこ とが好ましく、式(7)の割合は5~90モル%、特に $10 \sim 80$ モル%であることが好ましい。

【0048】ここで、本発明の重合体、即ちレジストベ ースポリマーの重量平均分子量は好ましくは2,000 ~100,000とすることが望まれ、2,000に満 たないと成膜性、解像性に劣る場合があり、100、0 30 びその混合溶剤が好ましく使用される。 00を超えると解像性に劣る場合がある。

【0049】本発明の重合体は、フォトレジスト材料、 特に化学増幅ポジ型レジスト材料のペースポリマーとし て好適に用いられる。この場合、本発明のフォトレジス ト材料の組成は、下記のものとすることができる。

(A) 上記重合体 (ペースポリマー)、(B) 酸発生 剤、(C)有機溶剤

【0050】ここで、本発明で使用される(B)成分の 酸発生剤は、300nm以下の高エネルギー線もしくは 電子線の照射により酸を発生する酸発生剤であり、なお 40 かつ当酸発生剤と先に示した本発明の重合体と有機溶剤 とよりなるレジスト材料が均一溶液で、均一な塗布、成 膜が可能であればいかなる酸発生剤でもよい。また、酸 発生剤は単独でも2種以上を混合して用いてもよい。

【0051】使用可能な酸発生剤の例としては、例えば トリフルオロメタンスルホン酸トリフェニルスルホニウ ムなどのトリフェニルスルホニウム塩誘導体、トリフル オロメタンスルホン酸ジp-t-プチルヨードニウムな どのジフェニルヨードニウム塩誘導体、その他各種オニ ウム塩類、アルキルスルホン酸類、ジアルキルスルフォ 50 トリシクロ [5.2.2.0^{...}] ウンデカン-3-オ

ニルジアゾメタン類、ジスルホン類、スルホン酸イミド 類などがある。酸発生剤の配合量は、全ベースポリマー 100部 (重量部、以下同じ) に対して、0.2~50 部、特に0.5から40部とすることが好ましく、0. 2部に満たないと露光時の酸発生量が少なく、感度及び 解像性が劣る場合があり、50部を超えるとレジストの 透過率が低下し、解像性が劣る場合がある。

【0052】また、本発明で使用される(C)成分の有 機溶剤としては、酸発生剤、ベースポリマー等が溶解可 能な有機溶剤であればいずれでもよい。このような有機 溶剤としては、例えばシクロヘキサノン等のケトン類、 1-メトキシ-2-プロパノール、1-エトキシ-2-プロパノール等のアルコール類、プロピレングリコール モノメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエ ーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、エ チレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリ コールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチ ルエーテル等のエーテル類、プロピレングリコールモノ メチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノ エチルエーテルアセテート、乳酸エチル、酢酸プチル、 3-メトキシプロピオン酸メチル、3-エトキシプロピ オン酸エチル等のエステル類、ィープチロラクトンなど のラクトン類が挙げられ、これらを単独で又は2種以上 を混合して使用することができるが、これらに限定され るものではない。本発明では、これらの有機溶剤の中で もレジスト成分中の酸発生剤の溶解性が最も優れている ジエチレングリコールジメチルエーテルや1-エトキシ -2-プロパノール、乳酸エチルの他、安全溶剤である プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート及

【0053】本発明のフォトレジスト材料の基本的構成 成分は上記の重合体、酸発生剤及び有機溶剤であるが、 必要に応じて更に、溶解阻止剤、酸性化合物、塩基性化 合物、安定剤、色素、界面活性剤などの他の公知の成分 を添加してもよい。

【0054】上記レジスト材料は、常法に従ってパター ン形成を行うことができ、典型的には、フォトレジスト 材料を基板上に塗布し、次いで加熱処理後、フォトマス クを介して波長300nm以下の高エネルギー線もしく は電子線で露光し、必要に応じて加熱処理した後、現像 液を用いて現像することによりパターンを形成すること ができる。

[0055]

【実施例】以下、実施例を示して本発明を具体的に説明 するが、本発明は下記実施例に制限されるものではな 41

【0056】 [実施例1] 8-メタクリロイルオキシー 4-オキサトリシクロ[5.2.2.01.6] ウンデカ ン-3-オンと9-メタクリロイルオキシ-4-オキサ

ンの混合物 (Monomer 1) の合成 [0057] 【化28】

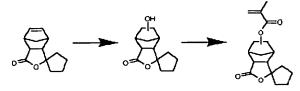
19

Monomer 1

【0058】 [実施例1-1] 還元反応:水素化ホウ素 10 ナトリウム7.0gを水50mlに溶かした溶液に、室 温でかき混ぜながら、ケトラクトン化合物、即ち、4-オキサトリシクロ[5.2.2.01.6] ウンデカー 3,8-ジオンと4-オキサトリシクロ[5.2.2. 01.1] ウンデカ-3, 9-ジオンの約1:1の混合物 57. 7gをテトラヒドロフラン100mlに溶かした 溶液を滴下した。室温で3時間かき混ぜた後、反応混合 物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル 溶液を、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で 洗い、硫酸マグネシウムで乾燥、減圧濃縮して粗ヒドロ 20 キシラクトン化合物、即ち、8-ヒドロキシー4-オキ サトリシクロ[5.2.2.01.6] ウンデカン-3-オンと9-ヒドロキシ-4-オキサトリシクロ[5. 2. 2. 01.1] ウンデカン-3-オンの混合物58. 3gを得た。

【0059】 [実施例1-2] メタクリロイル化反応: [実施例1-1] で得られた粗ヒドロキシラクトン化合 物58.3gとトリエチルアミン60ml、4-ジメチ ルアミノピリジン100mg、塩化メチレン200ml の混合物に、5~10℃でかき混ぜながら、塩化メタク リロイル35m1を滴下した。5~10℃で5時間かき 混ぜた後、反応混合物を氷水にあけ、酢酸エチルで抽出 した。酢酸エチル溶液を、希塩酸、飽和炭酸水素ナトリ ウム水溶液、飽和食塩水で洗い、硫酸マグネシウムで乾 燥、減圧濃縮、更にシリカゲルカラムクロマトグラフィ で精製して目的のメタクリレート化合物(Monome r 1) 63.1g (通算収率79%) を得た。 Monomer 1 (位置異性体混合物)のIR (液 膜): ν =2945、2873、1765、1713、 1320, 1296, 1173, 945cm⁻¹. Monomer 1 (位置異性体混合物)の H-NM R (300MHz, CDCl₃): $\delta = 1$. 40-2. 80 (12H, m), 4. 20-4. 54 (2H, m), 4.85-5.06(1H, m), 5.54-5. 0.6 (1H, m), 5. 5.4 - 5.60 (1H, m)m), 6.05-6.14 (1H, m) ppm. 【0060】 [実施例2] スピロ [シクロペンタン-1,5'-(8'-メタクリロイルオキシ-4'-オキ サトリシクロ [5.2.1.01.1] デカンー3'ーオ ン)] とスピロ[シクロペンタン-1,5'-(9'-50 3.58、24.21、24.55、32.89、3

メタクリロイルオキシー4'-オキサトリシクロ[5. 2. 1. 0'. '] デカン-3'-オン)] の混合物(M onomer 2)の合成 [0061] 【化29】

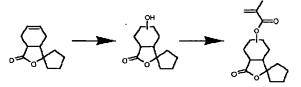


【0062】 [実施例2-1] 水ホウ素化-酸化反応:

スピロ[シクロペンタン-1,5'-(4'-オキサト リシクロ [5.2.1.01.6] デカー8'ーエンー 3'-オン)]24.5gをテトラヒドロフラン100 mlに溶かした溶液に、5~15℃でかき混ぜながら、 1.0Mーボランーテトラヒドロフラン溶液を滴下し た。この温度で1時間かき混ぜた後、水14ml、次い で2.5N-水酸化ナトリウム水溶液63mlを加え た。この混合物に、氷冷下かき混ぜながら、35%-過 酸化水素水48m1を反応温度を30℃以下に保ちなが ら、ゆっくりと滴下した。反応混合物を40℃で1時間 かき混ぜた後、氷水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢 酸エチル溶液を飽和食塩水で洗い、減圧濃縮して、粗ヒ ドロキシラクトン化合物、即ち、スピロ[シクロペンタ ン-1, 5'-(8'-ヒドロキシ-4'-オキサトリ シクロ[5.2.1.01.6] デカン-3'-オン)] とスピロ[シクロペンタン-1,5'-(9'-ヒドロ キシ-4'-オキサトリシクロ[5.2.1.0^{1.6}] デカン-3'-オン)]の混合物23.3gを得た。 【0063】 [実施例2-2] メタクリロイル化反応: [実施例1-2] の [実施例1-1] で得られた粗ヒド ロキシラクトン化合物のかわりに [実施例2-1] で得 られた粗ヒドロキシラクトン化合物23.3gを用い て、 [実施例1-2] と同様な方法でメタクリロイル化 反応を行い、シリカゲルカラムクロマトグラフィで精製 して目的のメタクリレート化合物(Monomer 2) 24.6g(通算収率71%)を得た。 Monomer 2 (立体及び位置異性体混合物)のI 40 R (液膜): ν=2964、2877、1761、17 13, 1325, 1302, 1169, 978 cm⁻¹. Monomer 2 (立体及び位置異性体混合物) の H-NMR (300MHz, CDCl₃): $\delta=1$. 3 5-3.30(19H, m), 4.80-5.16(1H, m), 5. 40-5. 65 (1H, m), 6. 00-6. 11 (1H, m) ppm. Monomer 2 (立体及び位置異性体混合物)のい3 C-NMR (75MHz、CDC1,、主要な二異性体 のピーク):18.17、18.17、23.41、2

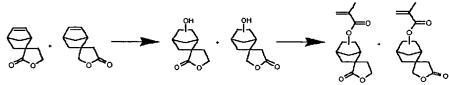
3. 56, 34. 07, 35. 29, 38. 61, 3 8. 72, 38. 94, 39. 28, 43. 64, 4 3. 96, 44. 53, 45. 48, 46. 05, 4 7. 21, 50. 36, 51. 09, 72. 85, 7 3. 61, 93. 77, 93. 97, 125. 11, 1 25. 44, 136. 28, 136. 44, 166. 2 5, 166. 96, 176. 41, 177. 24pp

【0064】 [実施例3] 1', 6'-cis-スピロ [シクロペンタン-1, 9'-(3'-メタクリロイル 10 オキシー8'-オキサビシクロ[4.3.0]ノナンー 7'-オン)]と1', 6'-cis-スピロ[シクロ ペンタン-1, 9'-(4'-メタクリロイルオキシー 8'-オキサビシクロ[4.3.0]ノナン-7'-オ ン)] の混合物 (Monomer 3) の合成 [0065]【化30】



Monomer 3

【0066】[実施例3-1]水ホウ素化-酸化反応: [実施例2-1] のスピロ[シクロペンタン-1, 5' - (4'-オキサトリシクロ[5.2.1.0^{2.6}]デ カ-8'-エン-3'-オン)]のかわりに1'.6' -cis-スピロ[シクロペンタン-1,9'-(8' -オキサビシクロ[4.3.0] ノナー3'-エン-同様な方法で水ホウ素化-酸化反応を行い、粗ヒドロキ シラクトン化合物、即ち、1', 6'-cis-スピロ [シクロペンタン-1, 9'-(3'-ヒドロキシー 8'-オキサビシクロ[4.3.0]ノナン-7'-オ ン)] と1', 6'-cis-スピロ[シクロペンタン -1, 9'-(4'-ヒドロキシ-8'-オキサビシク ロ[4.3.0] ノナン-7'-オン)] の混合物5



【0070】 [実施例4-1] ギ酸の付加-加メタノー ル分解反応:スピロ[5-ノルボルネン-2, 3'-テ トラヒドロフラン-2-オン] とスピロ [5-ノルボル ネン-2,4'-テトラヒドロフラン-2-オン]の混 合物164gに半酸800gを加え、100℃で10時 間かき混ぜた。冷却後、反応混合物を減圧濃縮して半酸 2.2gを得た。

【0067】 [実施例3-2] メタクリロイル化反応: [実施例1-2]の[実施例1-1]で得られた粗ヒド ロキシラクトン化合物のかわりに [実施例3-1] で得 られた粗ヒドロキシラクトン化合物52.2gを用い て、 [実施例1-2] と同様な方法でメタクリロイル化 反応を行い、シリカゲルカラムクロマトグラフィで精製 して目的のメタクリレート化合物 (Monomer 3) 52.2g(収率75%)を得た。

Monomer 3 (位置異性体混合物)のIR (液 膜): $\nu = 2958$ 、2866、1765、1707、 1633, 1346, 1298, 1191, 1161, 964、941cm⁻¹。

Monomer 3 (位置異性体混合物)の H-NM R (300MHz、CDCl₃、主要な異性体のピー δ): $\delta = 1$. 20-2. 50 (18H, m), 3. 0 3-3.12(1H, m), 4.60-4.70(1H, m), 5. 48-5. 56 (1H, m), 6. 02 -6. 12 (1H, m) ppm.

20 Monomer 3 (位置異性体混合物)の13C-NM R (300MHz、CDCl,、主要な異性体のピー β) : $\delta = 1.8.14, 2.3.31, 2.3.34, 2$ 3. 45, 28. 08, 29. 13, 33. 22, 3 7. 66, 41. 57, 42. 24, 69. 89, 9 5. 48, 125. 11, 136. 40, 166. 3 4.176.62ppm.

【0068】 [実施例4] スピロ [5-メタクリロイル オキシノルボルナン-2,3'-テトラヒドロフラン-2-オン]とスピロ[6-メタクリロイルオキシノルボ 7'-オン)] 48.1gを用いて[実施例2-1]と 30 ルナン-2,3'-テトラヒドロフラン-2-オン]と スピロ[5-メタクリロイルオキシノルボルナン-2, 4'-テトラヒドロフラン-2-オン]とスピロ[6-メタクリロイルオキシノルボルナン-2, 4'-テトラ ヒドロフラン-2-オン] の混合物 (Monomer 4) の合成

[0069]

【化31】

解した。トルエン溶液を飽和炭酸ナトリウム溶液で洗 い、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧濃縮した。この残 査にメタノール1,000mlと炭酸カリウム5gを加 えた混合物を室温で10時間かき混ぜた。反応混合物を 減圧濃縮してメタノールの大部分を除去し、残渣を酢酸 エチル1,000mlに溶解した。酢酸エチル溶液を2 の大部分を除去し、残渣をトルエン1,500mlに溶 50 0%塩酸次いで飽和食塩水で洗い、硫酸マグネシウムで 乾燥し、減圧濃縮して、粗ヒドロキシラクトン化合物、即ち、スピロ [5-ヒドロキシノルボルナン-2, 3'-テトラヒドロフラン-2-オン] とスピロ [6-ヒドロキシノルボルナン-2, 3'-テトラヒドロフラン-2-オン] とスピロ [5-ヒドロキシノルボルナン-2, 4'-テトラヒドロフラン-2-オン] とスピロ [6-ヒドロキシノルボルナン-2, 4'-テトラヒドロフラン-2-オン] の混合物 164gを得た。

【0071】 [実施例4-2] メタクリロイル化反応: [実施例1-2] の [実施例1-1] で得られた粗ヒド 10 ロキシラクトン化合物のかわりに [実施例4-1] で得られた粗ヒドロキシラクトン化合物82gを用いて、

[実施例1-2] と同様な方法でメタクリロイル化反応を行い、シリカゲルカラムクロマトグラフィで精製して目的のメタクリレート化合物(Monomer 4)89g(通算収率71%)を得た。

Monomer 4 (立体及び位置異性体混合物)のIR (液膜): ν =2966、2879、1784、1705、1632、1452、1414、1381、1331、1308、1290、1178、1022cm⁻¹。

Monomer 4 (立体及び位置異性体混合物)のい。 C-NMR (75MHz、CDCl, 主要な二異性体のピーク):18.18、18、18、33.71、3 4.72、34.93、35.49、37.86、3 9.09、39.88、42.20、42.39、4 3.33、43.64、44.12、45.70、4 5.95、75.76、75.89、75.91、8 0.06、125.39、125.42、136.3 3、136.34、166.84、166.84、17 30 6.18、176.31ppm。

【0072】 [実施例5] スピロ [5-アクリロイルオキシノルボルナン-2, 3'-テトラヒドロフラン-2-オン] とスピロ [6-アクリロイルオキシノルボルナン-2, 3'-テトラヒドロフラン-2-オン] とスピロ [5-アクリロイルオキシノルボルナン-2, 4'-テトラヒドロフラン-2-オン] とスピロ [6-アクリロイルオキシノルボルナン-2, 4'-テトラヒドロフラン-2-オン] の混合物(Monomer 5)の合成

[0073]

【化32】

Monomer 5

【0074】 [実施例5-1] アクリロイル化反応: [実施例4-1] で得られた粗ヒドロキシラクトン化合 50 物82gとトリエチルアミン100ml、4-ジメチルアミノピリジン200mg、塩化メチレン400mlの混合物に、5~10℃でかき混ぜながら、塩化アクリロイル56mlを滴下した。5~10℃で5時間かき混ぜた後、反応混合物を氷水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル溶液を、希塩酸、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗い、硫酸マグネシウムで乾燥、減圧濃縮、更にシリカゲルカラムクロマトグラフィで精製して目的のアクリレート化合物(Monomer 5)69.4g(通算収率59%)を得た。

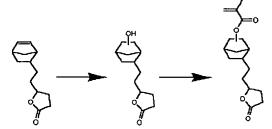
Monomer 5 (立体及び位置異性体混合物) のIR (液膜): $\nu = 2964$ 、2885、1780、1714、1633、1410、1306、1294、1279、1192、1014、984cm⁻¹。

Monomer 5 (立体及び位置異性体混合物) の H-NMR (300MHz、CDCl₃): δ=1.20-1.55 (3H、m)、1.60-1.80 (2H、m)、1.90-2.08 (1H、m)、2.10-2.22 (1H、m)、2.30-2.40 (1H、20m)、2.40-2.45 (1H、m)、2.45-2.60 (1H、m)、3.95-4.50 (2H、m)、4.60-4.90 (1H、m)、5.75-5.85 (1H、m)、6.00-6.15 (1H、m)、6.30-6.40 (1H、m) ppm。

【0075】 [実施例6] r-(5-メタクリロイルノルボルナン-2-イル) エチル-<math>r-ブチロラクトンと r-(6-メタクリロイルノルボルナン-2-イル) エチル-<math>r-ブチロラクトンの混合物Monomer 6 の合成

[0076] [化33]

40



Monomer 6

【0077】 [実施例6-1] ギ酸の付加-加メタノール分解反応: [実施例4-1] のスピロ [5- ノルボルネン-2, 3 $^{\prime}$ -テトラヒドロフラン-2 -オン] とスピロ [5- ノルボルネン-2, 4 $^{\prime}$ -テトラヒドロフラン-2 -オン] の混合物のかわりに γ - (5- ノルボルネン-2 - イル) エチル- γ - ブチロラクトン (endo o, exo - 混合物) 20. 6g を用いて、 [実施例4-1] と同様な方法でギ酸の付加-加メタノール分解反応を行い、粗ヒドロキシラクトン化合物、即ち、 γ - (5- ヒドロキシノルボルナン-2- イル) エチル- γ

ープチロラクトンとャー(6-ヒドロキシノルボルナン -2-イル) エチルーィープチロラクトンの混合物2 2. 4 gを得た。

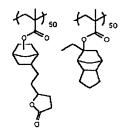
【0078】 [実施例6-2] メタクリロイル化反応: [実施例1-2] の [実施例1-1] で得られた粗ヒド ロキシラクトン化合物のかわりに [実施例6-1] で得 られた粗ヒドロキシラクトン化合物22.4gを用い て、 [実施例1-2] と同様な方法でメタクリロイル化 反応を行い、シリカゲルカラムクロマトグラフィで精製 して目的のメタクリレート化合物(Monomer 4) 24.3g (通算収率83%) を得た。

Monomer 6 (立体及び位置異性体混合物)のI R (液膜): ν=2954、2873、1776、17 13, 1635, 1454, 1325, 1296, 11 74, 1012 c m⁻¹.

Monomer 6 (立体及び位置異性体混合物) の H-NMR (300MHz, CDCl₃) : $\delta = 1$. 0 0-2.40(18H, m), 2.45-2.55(1H, m), 4. 35-4. 70 (2H, m), 5. 47 -5.50(1H, m), 6.00-6.70(1H,m) ppm.

【0079】 [実施例7] 下記重合体 (Polymer 1) の合成。

【化34】



Polymer 1

【0080】 [実施例6] で得たメタクリレート化合物 14.6g、8-エチル-8-トリシクロ[5.2. 1. 0^{1.6}] デシルメタクリレート12. 4g、N, N'-アゾピスイソプチロニトリル60mg、テトラヒ ドロフラン100mLの混合物を窒素雰囲気下、60℃ で20時間加熱攪拌した。放冷後、激しく攪拌したメタ ノール2 L中に反応混合物を滴下し、析出した沈殿をろ 40 取した。得られた固体をメタノール洗浄後、減圧乾燥し 目的の重合体を14.9g(収率55%)を得た。'H -NMRスペクトルの積分比より共重合比は50:50 であった。GPC分析による重量平均分子量はポリスチ レン換算で10, 200、分散度 (Mw/Mn) は1. 78であった。

【0081】 [実施例8] 重合体を用いたレジストパタ

ーン形成

実施例7で得られた重合体を用いて、下記に示す組成で レジスト材料を調製した。

- (A) ベースポリマー (実施例7で得られた重合体): 80重量部
- (B)酸発生剤:トリフルオロメタンスルホン酸トリフ エニルスルホニウム、1.0重量部
- (C) 溶剤:プロピレングリコールモノメチルエーテル アセテート、480重量部
- (D) その他:トリプチルアミン、0.08重量部 【0082】このものを0.2 μmのテフロン(登録商 標)フィルターを用いて濾過した後、90℃、40秒間 ヘキサメチルジシラザンを噴霧したシリコンウエハー上 へ回転塗布し、110℃、90秒間の熱処理を施して、 厚さ500nmのレジスト膜を形成した。これをArF エキシマレーザー光で露光し、110℃、90秒間の熱 処理を施した後、2.38%のテトラメチルアンモニウ ムヒドロキシド水溶液を用いて60秒間浸渍現像を行 い、1:1のライン・アンド・スペース・パターンを形 20 成した。現像済ウエハーを上空SEMで観察したとこ ろ、0.17μmのパターンまでパターン剥がれなく解 像していることが確認された。このことから本発明のフ オトレジスト材料は優れた基板密着性及び解像性を有す ることが分かった。

【0083】 [実施例9] 重合体の透明性の評価 実施例7で得た重合体1.0gをシクロヘキサノン6. 0gに溶解したのち、0. 2μ mのテフロンフィルター を用いて濾過した。得られた溶液を石英基板上に回転塗 布し、90℃、60秒間の熱処理を施して、膜厚500 30 nmの薄膜を形成した。この薄膜について、紫外可視分 光光度計を用いて193nmにおける透過率を測定し、 500nmあたり80%の透過率であった。この結果か ら本発明の重合体はエキシマレーザー用フォトレジスト ペースポリマーとして充分な透明性を有することが確認 された。

[0084]

【発明の効果】本発明の重合体は透明性、特にエキシマ レーザー露光波長での透明性に優れ、更に本発明の重合 体を用いて調製したレジスト材料は、髙エネルギー線に 感応し、解像性に優れ、電子線や遠紫外線による微細加 工に有用である。また基板密着性に優れるため、微細で しかも基板に対して垂直なパターンを容易に形成でき、 超LSI製造用の微細パターン形成材料として好適であ る。従って、本発明のラクトン構造を有する (メタ) ア クリレート化合物はフォトレジストの解像性を向上させ る上で非常に有用である。

【手続補正書】

【提出日】平成13年6月26日(2001.6.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)で表される(メタ)アクリレート化合物。

【化1】

$$= \bigvee_{0}^{R^1} \bigvee_{\substack{X \\ X \\ 0}} R^2$$

(式中、 R^1 は水素原子又はメチル基、 R^1 、 R^3 は水素原子、又は炭素数 $1\sim15$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基を表し、 R^1 と R^3 は結合して環を形成してもよく、その場合には、 R^1 と R^3 で炭素数 $2\sim15$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を表す。Xはって H_1 -、一C- H_2 -、一 H_3 -もしくは一〇一又は互いに分離した2個のHであることを表す。点線はノルボルナン環、ビシクロ [2.2.2] オクタン環、7-オキサノルボルナン環、又はシクロヘキサン環構造と γ -ブチロラクトン環構造とを結合する単結合、二価の有機基又はこれら両環構造間で一個又は二個の構成炭素原子を共有する構造を表す。)

【請求項2】 下記一般式(2)で表される(メタ)アクリレート化合物。

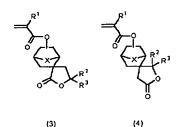
【化2】

$$= \bigvee_{0 \leq x} \bigvee_{0 \leq x} \bigvee_{R^2}$$

 個のメチレン基が酸素原子に置換されていてもよいー $(CH_1)_n$ - を表す。 n は $0 \le n \le 6$ を満たす整数を表す。)

【請求項3】 下記一般式(3)又は(4)で表される(メタ)アクリレート化合物。

(化3)



(式中、 R^1 は水素原子又はメチル基、 R^1 、 R^3 は水素原子、又は炭素数 $1\sim15$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基を表し、 R^1 と R^3 は結合して環を形成してもよく、その場合には、 R^1 と R^3 で炭素数 $2\sim15$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を表す。Xは CH_1- 、 $-CH_1$ CH_2- もしくは-O-又は互いに分離した 2 個の- Hであることを表す。)

【請求項4】 下記一般式(5)で表される(メタ)アクリレート化合物。

【化4】

$$= \begin{cases} R' \\ X \\ R^2 \\ R^3 \end{cases}$$

[5]

(式中、 R^1 は水素原子又はメチル基、 R^1 、 R^3 は水素原子、又は炭素数 $1\sim15$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基を表し、 R^1 と R^3 は結合して環を形成してもよく、その場合には、 R^1 と R^3 で炭素数 $2\sim15$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を表す。 Xは一 CH_1- 、 $-CH_1$ CH_1- もしくは-O-又は互いに分離した 2 個の- Hであることを表す。)

【請求項5】 下記一般式(6)で表される繰り返し単位を含有することを特徴とする重合体。

[化5]

(式中、 R^1 は水素原子又はメチル基、 R^2 、 R^3 は水素原子、又は炭素数 $1\sim15$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基を表し、 R^3 と R^3 で炭素数 $2\sim15$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を表す。 Xは一 CH_1- 、 $-CH_1$ CH $_1-$ もしくは-O-又は互いに分離した 2個の-Hであることを表す。 点線はノルボルナン環、ビシクロ [2.2.2] オクタン環、7-オキサノルボルナン環、又はシクロへキサン環構造とr-ブチロラクトン環構造とを結合する単結合、二価の有機基又はこれら両環構造間で一個又は二個の構成炭素原子を共有する構造を表す。)

【請求項6】 更に、下記一般式 (7) で表される繰り返し単位を含有し、重量平均分子量が2,000~100,00である請求項5記載の重合体。

【化6】

(式中、R'は水素原子又はメチル基、R'は炭素数4~20の三級アルキル基を表す。)

【請求項7】 (A) 請求項5又は6記載の重合体、

(B)酸発生剤、(C)有機溶剤を含有することを特徴とするフォトレジスト材料。

【請求項8】 (1)請求項7記載のフォトレジスト材料を基板上に塗布する工程と、(2)次いで加熱処理後、フォトマスクを介して波長300nm以下の高エネルギー線もしくは電子線で露光する工程と、(3)必要に応じて加熱処理した後、現像液を用いて現像する工程とを含むことを特徴とするパターン形成方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正内容】

【0008】(I)下記一般式(1)で表される(メ タ)アクリレート化合物。

【化7】

(式中、 R^1 は水素原子又はメチル基、 R^2 、 R^3 は水素原子、又は炭素数 $1\sim 15$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基を表し、 R^3 と R^3 は結合して環を形成してもよく、その場合には、 R^4 と R^3 で炭素数 $2\sim 15$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を表す。 X はって H_1 で、 H_2 で以この では互いに分離した H_3 で H_4 では H_4 で H_5 で H_5

(II)下記一般式(2)で表される(メタ)アクリレート化合物。

【化8】

$$= \begin{cases} R^1 \\ \begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix} \\ R^3 \end{cases}$$

(式中、 R^1 は水素原子又はメチル基、 R^1 、 R^3 は水素原子、又は炭素数 $1\sim 15$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基を表し、 R^1 と R^3 で炭素数 $2\sim 15$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を表す。 Xは一 CH_1-CH_1- もしくは-O-又は互いに分離した 2 個の-Hであることを表す。 Y は一個又は複数個のメチレン基が酸素原子に置換されていてもよい-(CH_1)。-を表す。 n は $0\leq n\leq 6$ を満たす整数を表す。)

(III) 下記一般式(3) 又は(4) で表される(メタ) アクリレート化合物。

【化9】

(式中、 R^1 は水素原子又はメチル基、 R^2 、 R^3 は水素原子、又は炭素数 $1\sim15$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基を表し、 R^2 と R^3 は結合して環を形成してもよく、その場合には、 R^2 と R^3 で炭素数 $2\sim15$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を表す。Xはって H_1 -、-C H_2 -もしくは H_3 -もしくは H_4 -の一又は互いに分離した H_4 -であることを表す。 H_4

(IV)下記一般式(5)で表される(メタ)アクリレート化合物。

【化10】

(5)

(V) 下記一般式(6) で表される繰り返し単位を含有することを特徴とする重合体。

【化11】

(式中、 R^1 は水素原子又はメチル基、 R^1 、 R^3 は水素原子、又は炭素数 $1\sim 15$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基を表し、 R^1 と R^3 は結合して環を形成してもよく、その場合には、 R^1 と R^3 で炭素数 $2\sim 15$ の

直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を表す。 Xはっ CH_1- 、っ CH_1 CH_2 っもしくは - O っ又は互いに分離した 2 個の - H であることを表す。 点線はノルボルナン環、ビシクロ [2.2.2] オクタン環、7 っオキサノルボルナン環、又はシクロヘキサン環構造と γ っプチロラクトン環構造とを結合する単結合、二価の有機基又はこれら両環構造間で一個又は二個の構成炭素原子を共有する構造を表す。)

(VI) 更に、下記一般式 (7) で表される繰り返し単位を含有し、重量平均分子量が 2 , 000~100 , 00 である (V) 記載の重合体。

【化12】



(式中、R⁴は水素原子又はメチル基、R⁵は炭素数4~20の三級アルキル基を表す。)

(VII) (A) (V) 又は (VI) 記載の重合体、

(B)酸発生剤、(C)有機溶剤を含有することを特徴とするフォトレジスト材料。

(VIII) (1) (VII) 記載のフォトレジスト材料を基板上に塗布する工程と、(2) 次いで加熱処理後、フォトマスクを介して波長300nm以下の高エネルギー線もしくは電子線で露光する工程と、(3) 必要に応じて加熱処理した後、現像液を用いて現像する工程とを含むことを特徴とするパターン形成方法。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0039

【補正方法】変更

【補正内容】

【0039】本発明の重合体は、上記(メタ)アクリレート化合物をモノマーとして用いて得られ、この(メタ)アクリレート化合物に由来する下記繰り返し単位(6)を有するものである。

【化26】

フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁷

識別記号

H 0 1 L 21/027

FΙ

テーマコード(参考)

H 0 1 L 21/30 5 0 2 R

(72)発明者 長谷川 幸士

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工業株式会社新機能材料技術研究 所内

(72)発明者 渡辺 武

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工業株式会社新機能材料技術研究 所内

Fターム(参考) 2H025 AA01 AA02 AA09 AB16 AC04

AC08 AD03 BE00 BE10 BG00 CB14 CB41 CC03 FA01 FA12

4C037 EA10 WA01 XA01

4J100 AL08P BA02P BA11P BC04P BC08P BC53P CA01 JA38

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

— MAIGLEET OFF AT TOT, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.